

Zur Herstellung von Flächen in bestimmter kristallographischer Lage sind eine Reihe von Apparaten konstruiert. Ausgezeichnete Ergebnisse (Genauigkeiten bis auf 1–2' und vollkommen ebene Flächen) erzielt man mittels des Wüllingschen Schleifapparates (Fig. 338).

Er besteht aus einem Dreifuß mit zwei Stellschrauben T und R als Auflagen auf der Schleiffläche, während der dritte Fuß k als Kristallträger ausgebildet ist. Es sind davon mehrere Exemplare k_1, k_2, k_3, k_4 (Fig. 338) vorhanden, deren untere Flächen jeweils unter Winkeln von 0° bis 60° wechselnd abgeschragt sind. Sie sind austauschbar und werden mit der Schraube M befestigt. Eine auf den Schleifdreifuß in ihrer Lage festgelegte Dosenlibelle mit Mikrometerschrauben u. Skala, mittels derer noch $\frac{1}{4}'$ Winkelverschiebung geschätzt werden kann, dient als Hilfsapparat beim Ausrichten des Kristalls zur Schleifplatte.

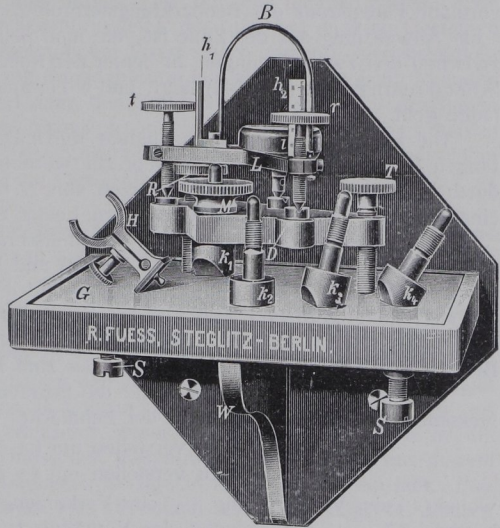


Fig. 338. Schleifapparat nach Wülling. k_1, k_2, k_3, k_4 Kristallträger für Schleifdreifuß D , L Libellendreifuß mit Griff B , r, t Mikrometerschrauben für Dosenlibelle L , k, T Stellschrauben für D, H Halter zum Aufsetzen des Schleifdreifußes auf das Goniometer, G Horizontfläche.

Als Beispiel sei die Aufgabe erörtert, eine Fläche tautozonal mit zwei gegebenen Flächen A und B unter bestimmten Winkeln α und β zu ihnen anzuschleifen. Man kittet den Kristall auf einen passenden Träger K so auf, daß die anzuschleifende Fläche möglichst annähernd horizontale Lage haben würde, und dreht den Kristallträger so, daß die Zonenachse gemäß der Fig. 339 der Verbindungslinie von R und T parallel ist. Nunmehr schleift man eine recht kleine „Fehlfläche“ F an und mißt, nachdem das ganze System Schleiffuß und Kristall mit der Gabel H am Goniometer fest-

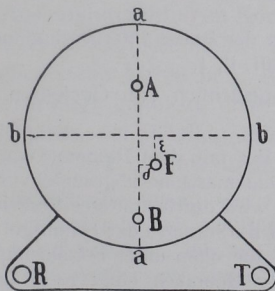


Fig. 339.

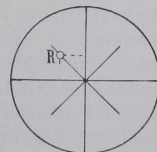


Fig. 340.